High Gradient Test of S-band Disk Loaded Structure Y.YAMAOKA and Linear Collider Study Group* Institute of Applied Physics, University of Tsukuba Tennodai,Tsukuba-shi,Ibaraki 305 * KEK, National Laboratory for High Energy Physics Oho,Tsukuba-shi,Ibaraki 305

Abstract

The present status of high gradient test of S-band disk loaded structure is outlined. The accelerating gradient of 50MV/m was attained after RF conditioning for 190 hours. The effect of RF conditioning is observed in field emission current. A microscopic field enhancement factor (3 in Fowler-Nordheim Plot is obtained to be 56.8.

1.はじめに

重心系エネルギー1TeVのリニアコライダー実現のためには、100MV/m以上の加速電界を維持できる加速管が 要求される。これは現在運転されているリニアックに比べ一桁大きな値である。このような高電界を発生させる時 に問題となるのは、加速管表面から放出される電界放出電流であり、またそれによって引き起こされる放電である。 加速管の高電界試験はSLAC、VARIAN、KEKなどですでに行われている(文献1、2)。SLAC、VARIANの実験は、 定在波モードの加速管を使用して行なわれたのに対して、KEKでは進行波モードであった。しかし、これらの実験で 用いられた加速管はSLACは7セル、VARIANは単セル、KEKは5セルといづれもテスト用の短いものであった。現在 KEKにおいて、Sバンドで長さ0.6m(RF結合空洞も含め19セル)の実用型の加速管で実験を行っている。この実 験から、Sバンドにおける最大加速電界強度を決めるのに重要なデータを得ることができる。ここでは、その途中経 過を報告する。

<u>2.実験</u>

2-1) 概要

電界放出現象があらわに効いてくるのは、理想表面の場合、表面電界が1GV/mを上回る極めて高い場合である。 しかし、実際には40MV/m程度の表面電界があると、電界放出による暗電流が無視できなくなる。この原因として、 表面に存在する微小突起や酸化不純物の付着のため、実際には局所的に大きな電界が発生していると考えられている。 実際の表面の評価として、局所的に増大された電界と理想表面の電界の比(3の比較がある。(3は、Fowler-Nordheim





図 2 実験装置の写真。エネルギー分析 マグネットから加速管を中心に撮った。 Plotから実験的に求めることができる。すなわち、

d(log10 1/Es2) _ 2.84×109×41.5

d(1/Es) β 1旦Lφ=4ev for Cu このβが小さいほど理想表面に近く、電界放出電流も小さい。

SLAC、VARIAN、KEKでの実験から求められたβの値は、6 0~120であった。

この電界放出電流やそれによって起きる放電について、その 発生する場所と時間、強度および、エージング効果を調べるた めに、以下の診断装置を用意した。

2-2) 実験装置

実験装置の概略図を図1に、写真を図2に示す。加速管に最 大200MWのパワーを供給する(この時の加速電界強度は、 100MV/mになる。)ことができるようにするために、2本 のSLAC-5045クライストロンのパワーを合成した(文献3)。 運転の繰り返しは25pps、RFパルス幅は1µsccである。表1 に加速管のパラメータを示す。加速管は、一定電界型で、材質 は、OFHC銅を使用している。加速管はsk先端部表面は、0.3µ mの粗度で加工され、銀ロー付け法で作られた。ローパワー測 定の結果から加速電界は、次のように書ける。

 $Eacc(MV/m) = 7.13* \sqrt{P(MW)}$

加速管を透過したRFはwater load で吸収し、熱量的にパワー 測定を行なう。

電界放出電流のピーク値と波形は、C.T.(Current Transformer) で、平均電流は、ファラデーカップで測定する。電界放出電 子のエネルギースペクトラムは、エネルギーアナライザーマグ ネットの磁場から測定できる。電界放出電子のビームプロファ イルは、デマルケストをビームラインに挿入して画像処理して 見る。

シンチレーションカウンターは、加速管の軸方向に沿って1 0本並べた。プラスチックシンチレーターの大きさは、5×1 0×20mmで、加速管外壁に直接とりつけた。これにより、 それぞれの位置におけるX線の強度と時間情報が得られる。各 カウンターの光電子増倍管のゲインは、実験開始前にチェッキ ングソースを用いて同一になるよう調整した。X線サーベイメ ータは、厚さ5cmの鉛ブロックで囲い直径5mmの穴を開けコ リメートしてある。それを軸方向にスキャンしてX線強度を測 定する。さらに、加速管全体にラドカラーを貼り、その変色か らX線の積分値を調べる。

残留ガスの組成分析のため、四極質量分析器を設置した。 <u>3. 実験結果</u>

7/20から実験を開始して8/3の時点で200時間経過した。 図3にエージング時間に対する入力パワーの関係を示す。

図4に加速電界強度が40MV/m時の電界放出電子のエネル

-256 -

表1 Parameter of the structure	
Phase Shifi / cell	2pai/3
Structure Length	63,4 cm
Number of cells	17+2
Resonant Frequency	2.856 GHz
Q-value	11600
Shunt Impeadanc	62 MΩ /m
Attenuation	0.367 Neper/m
Mean Group Velocity	0.00445*c
Filling Time	0.475 µsec



図3 エージング時間に対する入力パワーの記録。





ギースペクトラムを示す。 7/28と8/2のデータでスペク トラムに大きな違いが見ら れた。7/28の時点では、電 界放出が加速管全体で起き ていたのに対し、8/2では 出力結合空胴付近で重点的 に起きていることがわかる。 出力結合空胴付近を除く加 速管全体でエージング効果 が表われている。エージン グ効果は、電界放出電流の 大きさにも現われている (図5)。

Fowler-NordheimPlotを図 6 に示す。 8 / 1 に測定した 電流の大きさは 7 / 2 7 に 比べ減少しているが、 は逆に 5 6.8 から 6 6.6 に大きくなった。

図7に加速電界強度が40







図7各測定器出力波形。上からCT上流.下流、 シンチレーションカウンター(上流から下流 の順)、加速管入力RF、出力RF。

図8電界強度に対する放出ガスの分圧。

20

MV/m時のCT、シンチレーションカウンター、RFの同じ時間スケールでの波形を示す。CTで測定した電界放出電流のビーク値は、加速管上流側で4mA、下流側で15mAがパルス毎に安定に流れ、上流側にも下流側の1/3~1 /4程度の電流が流れていることが確かめられた。

Ep(hv/h)

図8は、電界に対する放出ガスの分圧の関係を示している。加速管にRFパワーが入るとH2の分圧比が特に上昇する ことがわかった。

<u>4.今後の予定</u>

文献

引き続きエージングを行ない加速電界強度を100MV/mまで上げていき、上で述べた評価をしていく。実験終了 後は、加速管を切断し、内部の損傷などの観察を行う。今回の実験で用いた加速管は、銀ロー付け法であったが、同 じ長さの電鋳法の加速管についても実験を行い、データの比較を行う予定である。

1) Loew,G.A, and Wang,J.W., "RF Breakdown Studies in Roon Temperature Electron Linac Structures", SLAC-PUB-4647,Ma y 1988

2) Matsumoto, H et al ,"RF BreakdownStudieson S-band Disk-loadedStructure", Proc. of the 1987 IEEE Particle Accelerator Con ference (Washington D.C.)1654 (1987)

- 257 -

3) Matsumoto, H et al, "High Power Combination for the JLC S-band RF source "